

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification n° 1

Juillet 1985
à la

Amendment No. 1

July 1985
to

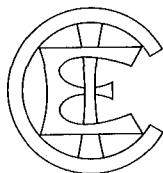
Publication 245-5
1980

**Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc,
de tension nominale au plus égale à 450/750 V**

Cinquième partie : Câbles pour ascenseurs

**Rubber insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V**

Part 5 : Lift cables



© CEI 1985

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

PRÉFACE

La présente modification a été établie par le Sous-Comité 20B : Câbles de basse tension, du Comité d'Etudes n° 20 de la CEI : Câbles électriques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants :

Règle des Six Mois	Rapport de vote
20B(BC)88	20B(BC)95

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

Page 12

TABLEAU II

Essais concernant les câbles des types 245 IEC 70, 245 IEC 74 et 245 IEC 75

Remplacer, dans ce tableau, le texte concernant les n° de référence 3.4 et 4.3 par le suivant et supprimer la note au bas du tableau :

1	2	3	4
N° de réf.	Essai	Catégorie de l'essai	Méthode d'essai décrite dans :
3.4	Essai d'allongement à chaud	T	Publication 540 de la CEI article 14
4.3	Essai d'allongement à chaud	T	article 14

PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 20B : Low-voltage Cables, of IEC Technical Committee No. 20 : Electric Cables.

The text of this amendment is based upon the following documents :

Six Months' Rule	Report on Voting
20B(CO)88	20B(CO)95

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

Page 12

TABLE II

Tests for Types 245 IEC 70, 245 IEC 74 and 245 IEC 75

Replace, in this table, the text for Reference Nos. 3.4 and 4.3 by the following and delete the footnote to the table :

1	2	3	4
Ref. No.	Test	Category of test	Test method described in :
3.4	Hot set test	T	IEC Publication 540 Clause 14
4.3	Hot set test	T	Clause 14